

波長分散型蛍光 X 線分析装置

【メーカー】 リガク(株)

【型式】 ZSX Primus II

【設置場所】 教育学部 3 号館 1 階 105 号室

【仕様】

- ・ エンドウィンドウ型 Rh ターゲット
4 k W 上面照射型
- ・ 48 試料セット可能なサンプルチェンジャ
- ・ 分光結晶 (LiF(200), LiF(220), Ge, PET, RX25)
- ・ 検出機 (SC, F-PC)
- ・ 視野制限スリット (35, 30, 20, 10, 1, 0.5mm)
- ・ 1 次 X 線フィルタ (Al, Ti, Cu, Zr)
- ・ 点滴法により、液体試料も測定可
- ・ SQX ソフトウェア (EZ スキャン, SQX 薄膜など), 散乱線 FP 法, ガラスビード補正, 自動プログラム運転, 試料観察機構(CCD カメラ内臓), ポイント・マッピング機構など



機器説明

- ・ F~U までの定性・定量分析が可能。
- ・ ファンダメンタルパラメータ技術を集約した SQX ソフトウェアにより、対話形式による設定だけで定性分析と元素同定・半定量分析が可能。
- ・ 測定できる試料は、粉末試料 (ガラス・セメント・セラミック・岩石・土壌など), 金属・合金試料, ポリマー (ポリマーシート・紙・多層コーティングされた試料) の膜厚と組成の同時分析, ガラスビード (ガラス・セメント・セラミック・岩石・土壌など), 油, 液体 (フィルター法による), 植物・食品, 石器など。
- ・ 岩石, セメント, ガラス, セラミック, 土壌に関しては、ガラスビード法・粉末ペレット法により以下の元素に関して検量線法での精密測定が可能。
SiO₂, TiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, MnO, MgO, CaO, Na₂O, K₂O, P₂O₅ (以上 wt%) F, S, Cl, Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ba, Hf, Pb, Th U, La, Ce, Nd, Sm (以上 ppm)
- ・ 試料サイズは 1mm あれば測定できます。微量粉末にも対応可能。
- ・ 内臓 CCD カメラにより、任意の位置のスポット径 500 μm でのポイント, ライン, エリアの元素マッピング分析が可能。100 μm のマッピング分解能です。
- ・ 液体試料では ppb レベルでの分析も可能です。

【備考欄】

設備・機器の管理者に直接お問い合わせが必要です。

管理者: 角縁 進

管理者所属: 教育学部

Email: kakubuch@cc.saga-u.ac.jp

内線: 8229